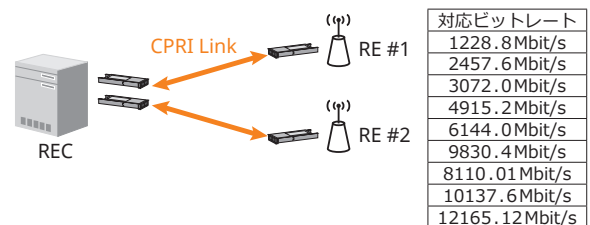


# LTE向けCPRI規格v6.1対応の 光モジュールの評価に

BERTWave MP2100B

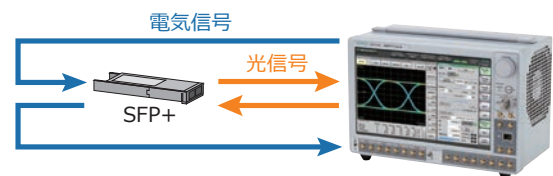


BERTWave MP2100Bは、BERT、アイ/パルススコープ機能、およびジッタ解析機能を1台に搭載することにより、BER測定とアイパターン解析が同時にできるため、測定時間の短縮に貢献します。さらに、煩雑な配線が減少することにより測定を効率化します。LTE向けCPRI規格v6.1のビットレート(12.1G、10.1G、8.1G、9.8G、6.14G、4.92G、3.07G、2.46G、1.23Gbit/s)に対応しているため、LTE向けCPRI規格v6.1対応光トランシーバの評価に適しています。

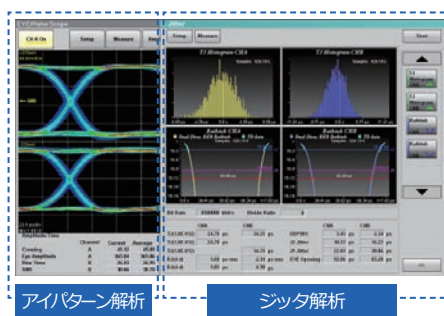
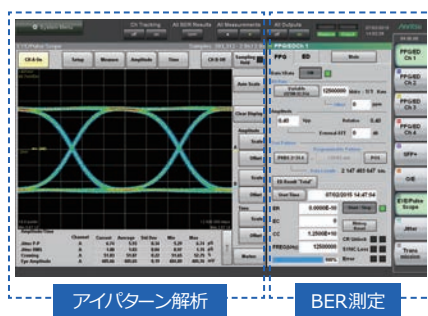


## LTE向けCPRI規格v6.1対応光モジュールの評価

CPRI規格v6.1では、CJPAT Patternを使用したアイパターンのTr/Tf、アイマスク、Total Jitter (TJ)およびDeterministic Jitter (DJ)が規定されています。これらの規格化されている項目を測定するためには、BERT、サンプリングオシロスコープ、ジッタ解析機が必要になります。



## BERTWaveは、BER測定、アイパターン解析、ジッタ解析を1台で同時に測定可能



## BER測定、アイパターン解析、ジッタ解析を同時測定

PPG、ED、サンプリングオシロスコープを1台に搭載しているため、CJPATパターンやPRBSパターンを使用したBER、Tr/Tf測定、アイマスク試験が同時に実施できます。さらに、サンプリングオシロスコープを使用したTotal Jitter (TJ)、Deterministic Jitter (DJ)の解析も同時に実施できます。

## 5倍の高速測定(従来製品比)

アイパターン解析とジッタ解析が同時に実施できるため、従来製品に比べて2倍の高速測定ができます。また、高速サンプリング(150ksample/s)の実現により従来製品に比べて2.5倍の高速測定ができます。バスタブBER解析によるTJ(1.0e-12)を高速に予測可能です。

## 任意信号のジッタ測定

装置から出力される実信号やPRBS 31を含む任意の信号が測定できます。

### アイパターン測定と同時に分解可能なジッタ

TJ BER	: Total Jitter at 1.0e-12
DJdd	: Deterministic Jitter (Dual Dirac model)
RJdd	: Random Jitter (Dual Dirac model)
TJ at sBER	: Total Jitter at specified BER
Eye Opening	: Horizontal Eye opening at specified BER
J2 BER	: Total Jitter at 2.5e-3
J9 BER	: Total Jitter at 2.5e-10

## BERTWave MP2100B ラインアップ

All in  
One

BERTとScopeを1台に搭載

4ch  
BERT

1~4ch 12.5Gbit/s BERTを搭載

ジッタ  
1  
ps rms

Pulse Pattern Generator (PPG)  
ジッタ: 1 ps rms

感度  
10  
mVp-p

Error Detector (ED)  
感度: 10 mVp-p

### 測定時間の短縮

4ch BERTとアイパターンを1台で同時測定  
4ch BERT同時測定  
高速アイマスク試験  
高速BERT試験

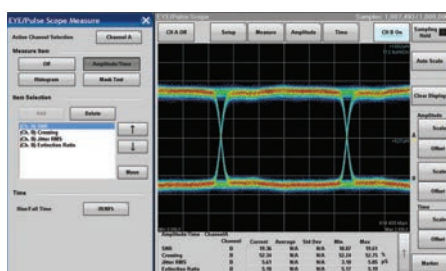
### 多彩な解析機能

広帯域な動作周波数  
電気・光インタフェースに対応  
ジッタ解析  
クロックリカバリ

### 無駄の無い投資

柔軟な測定系の構築  
マルチチャネルBERT

## 代表波形



Bit rate: 6.14Gbit/s, PRBS15  
Amplitude: 0.5Vp-p, Sampling: 100万ポイント

## 特長

- BER試験とアイパターン解析を1台で実現
- 4倍の高速リモート制御(従来製品比)
- 10倍のBER測定時間分解能10ms(従来製品比)
- 4ch同時、独立BERT測定
- 高速サンプリングスピード
- 自動マスクマージンテスト
- 低バラツキLPFによる安定した消光比/Mask Margin測定

